

## 1. 中心量測服務

儀器名稱	量測項目	收費標準		
		學術研究單位	營利事業單位	聯盟會員
場發射掃描式電子顯微鏡 SEM (JEOL JSM-6700F)	試片大小限制:直徑 $\phi$ 25mm 高度 10mm 倍率: 25~650,000 倍 (視樣品與情況而增減) 高分子材料不可量測	2500 元/小時	3000 元/小時	2500 元/小時
元素能量分析儀 EDS	試片大小限制:直徑 $\phi$ 25 mm 高度 10 mm 倍率: 3000 倍~5000 倍 高分子材料不可量測	2500 元/小時	3000 元/小時	2500 元/小時
光譜式橢圓偏振儀 Ellipsometer (SOPRA GES5)	量測範圍:190 nm~1700 nm 量測項目: 折射率、消光係數、膜厚、多角度穿透/反射率	2500 元/小時	3000 元/小時	2500 元/小時
原子力顯微鏡 AFM (DI SPM-II)	試片大小限制:直徑 $\phi$ 10 mm 高度 3 mm 量測範圍:0.5×0.5~15×15 $\mu\text{m}^2$	2500 元/小時	3000 元/小時	2500 元/小時
X 光繞射儀 XRD	試片大小限制: 2.5*2.5*0.5 $\text{cm}^3$ 量測角度:10°~168°	1000 元/小時	1500 元/小時	1000 元/小時
膜厚量測儀 (a-step)	掃描長度:50 $\mu\text{m}$ ~30mm 量測項目:薄膜厚度、表面圖形量測	1000 元/小時	1500 元/小時	1000 元/小時
紅外光光譜儀 FTIR (HORIBA-T720)	量測範圍:4000~400 $\text{cm}^{-1}$ 量測項目:穿透率	1000 元/小時	1500 元/小時	1000 元/小時
光譜儀 (Hitachi U-4100)	量測範圍:190 nm~2500 nm 量測項目:穿透率、5 度角絕對反射率、吸收係數	1000 元/小時	1500 元/小時	1000 元/小時

## 2. 中心鍍膜收費標準

種類		學術研究單位	營利事業單位	聯盟會員
AR		15,000 元起	20,000 元起	15,000 元起
HR (Edge Filter)		35,000 元起	45,000 元起	35,000 元起
單層膜	SiO <sub>2</sub> 、MgF <sub>2</sub> 、Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> ... 等	6,000 元	8,000 元	6,000 元
Metal	Al、Cr	6,000 元	8,000 元	6,000 元
	Au、Ag、Pt	貴重金屬需另加材料費		
備 註		1. AR、HR 如需測試鍋及測試資料另計； 2. 設計複雜(如需針對角度、雙波域、偏振光)須另計設計費； 3. 交期:4 周，急件(2 周內)加 50%。		